BL-7C, BL-11B/2018G509

# X線天文衛星で用いる真空蓋の透過率曲線の詳細測定 Transmission curve measurement of the vacuum window for the X-ray astronomy satellite

御堂岡拓哉<sub>1,2\*</sub>, 辻本匡弘<sub>1</sub>, 北本俊二<sub>3</sub> <sub>1</sub>宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所(ISAS) 〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1 <sub>2</sub>東京大学, 〒113-8654 東京都文京区本郷 7-3-1 <sub>3</sub>立教大学, 〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-3-4-1 Takuya MIDOOKA<sub>1,2\*</sub>, Masahiro TSUJIMOTO<sub>1</sub>, Shunji KITAMOTO<sub>3</sub> 1Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)/ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 3-1-1 Yoshinodai, Chuo, Sagamihara, Kanagawa, 252-5210, Japan

<sub>2</sub>The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo, Tokyo, 113-8654, Japan

3Rikkyo University, 3-3-4-1 Nishiikebukuro, Toyoshima, Tokyo, 171-8501, Japan

## 1 <u>はじめに</u>

2016年に打ち上げられた X 線天文衛星「ひとみ」 に搭載された軟 X 線分光装置(Soft X-ray Spectrometer; SXS)は、デュワー容器内で 50 mK の極低温に制御さ れた X 線マイクロカロリメータ検出器を動作させる ことにより、2-12 keV の広帯域で、高エネルギー分 解能(E/ΔE~1200@6 keV)を達成した[1]。デュワー容 器の X 線入射部には、地上での真空保持と打ち上げ 後初期の衛星内アウトガスの影響を避けるため、約 3 cm 径の真空蓋(=ゲートバルブ)が設置された。 ゲートバルブは厚さ約 270 µm の Be 窓が溶接され (図 1)、ステンレスメッシュで Be 窓表面を保護し ている。



図1:真空蓋に用いられる Be 窓。安全のため、ホル ダーに装着されている

「ひとみ」衛星は姿勢制御の不具合により1ヶ月 ほどで運用を断念したため、全ての観測がゲートバ ルブを通して行われた。打ち上げ前にはゲートバル ブの透過率測定は行われなかったため、運用終了後 にフライトスペア品の Be 窓の透過率測定を行い、 較正データベースファイルが作成された[2,3]。この 際、ステンレスメッシュの測定はなされていない上 に、Be 窓の透過率モデルにも物理的に原因の特定で きない不連続な構造が存在した。そのため、SXS で 得られた「かに」星雲のスペクトルには、特に 2.0-4.0 keV 帯域において、ゲートバルブ由来の系統誤差 が顕著に含まれており、広帯域高エネルギー分解能 スペクトルを用いた天体物理学の解釈に大きな不定 性が残った[4]。

2022 年打ち上げ予定の X 線撮像分光衛星 XRISM に搭載される分光装置 Resolve は SXS とほぼ同じ設 計であり、高分解能 X 線分光で新たなサイエンスを 切り拓くことが期待されている。XRISM 衛星打ち上 げ後 3 ヶ月ほど行われる初期観測のデータは全てゲ ートバルブを通して得られるため、これらのデータ から科学成果を得るにはその X 線透過率を精密に測 定しておく必要がある。科学目的から導かれる較正 精度要求は、2.5-12 keV 帯域で、(1)連続成分の透過 率誤差<1%、(2)吸収端など構造部の誤差<5%、(3)透 過率の空間非一様性<3%である[5]。これらを測定で きるのはシンクロトロン放射光施設しかなく、我々 は SXS フライトスペア品に続いて今回も PF を利用 した。

#### 2 <u>実験</u>

BL-7C では試料と検出器を大気下に置き、4.0-12.0 keV 帯での透過率のエネルギー依存性測定を行なっ た。BL-11B では持ち込んだ真空チャンバ内に試料 と検出器を置き、二結晶分光器に Si(111)結晶を用い た 2.1-5.0 keV 帯での透過率のエネルギー依存性測定 及び InSb(111)結晶を用いた 1.8-3.5 keV 帯での測定を 行なった。また、Si 結晶を用いて 2.7 keV, 3.0 keV, 3. 456 keV, 4.0 keV の単色 X 線を試料全面にスキャンさ せた位置依存性測定も行なった。試料は、X-Y ステ ージの上に設置され、真空槽外からの操作により、 ビーム位置の調整とビームから外す操作が可能である。

#### 3 <u>結果および考察</u>

BL7C, BL11B のそれぞれにおける透過率測定結果 と暫定的に 250 μm 厚の Be による光電吸収を仮定し たモデルとの比を図 2 に示す。





2.4 keV 以下のエネルギー帯において、Si と InSb のどちらも高次光混入による影響と見られる透過率 上昇が確認された。透過率上昇の原因を探るため InSb 結晶を追加で用いたのだが、結果的に Si 結晶で 得られた透過率カーブとも異なる結果となった。通 常時は光路から外してある追加のミラーを挿入する か、二結晶分光器の detuning を行うことで、高次光 の影響を分離できると思われるが、ビームタイム中 に実施することはできなかった。

そこで測定結果の考察は 2.8-12 keV 帯域を用いて 行なった。まず、Be以外に混入している可能性のあ る Fe, Ni, Cr, Mn, Cuの元素について、それぞれの吸 収端エネルギー前後にて、Beと微小元素の厚みをパ ラメータにしたフィッティングを行い、含有量を決 定した(表 1)。

次に、図2の3.4 keV, 6.1 keV 付近に確認できる、 どの元素の吸収端とも一致しない透過率不連続低下 構造についての考察を行なった。SXS の Be 窓透過 率測定では物理的描像を解明できず、ゲートバルブ の透過率不定性の大きな一因となっていた。本研究 では、結晶面(*hkl*)の格子間隔 *dhkl*に対して、Bragg 条 件(2*dhkl* sin $\theta = hc/E$ )を満たすエネルギー*Ehkl*で、 $\theta$ -90° 方向に極端な異方性を持った散乱を起こす描像 (Bragg Diffraction Features; BDFs)を考えることで説明 することに成功した。つまり、各結晶面に対応する エネルギーEnkiで不連続的に X 線が回折し始める、 言い換えると、不連続に透過率が減少することにな り、測定結果と一致する。六方晶に属する Be の格 子間隔 dnkiに対して、Bragg 条件を解くことによって Enki を計算し、その前後のエネルギー帯にて BDF の 深さをフィッティングで算出しモデル化を行なった。

結果的に、(1) 253.5 µm 厚の Be の光電吸収、(2) 表 1 にまとめた厚みを持つ微小元素 (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu) の光電吸収、(3) Be 結晶面(*hkl*)に応じた *Ehkl* で階段 状に透過率低下する BDF 構造の 3 成分をモデル化す ることで、透過率不定性を 0.2%以下に抑えることに 成功した(図 3)。本研究で得られた透過率モデル は XRISM 衛星の初期データ解析に不可欠な較正デ ータベースファイルとして公開予定である。



図 3: 測定で得られた 2.8-12.0 keV 帯の透過率カーブ と 3 成分を用いたベストモデル透過率カーブとの比。 緑線が微小元素の吸収端を紫線が各結晶面に対応する *Ehkl*を示す。

次に、BL11B を用いた透過率の位置依存性測定に ついてまとめる。2.7 keV, 3.0 keV, 3.456 keV, 4.0 keV の4つの単色 X 線を用いてスキャン測定を行なった。 代表的に 2.7 keV の X 線で得られた二次元透過率マ ップを図4に示す。左下部の透過率が他の部分より



図 4:2.7 keVの X線で得られた二次元透過率マップ

微小元素	吸収端エネルギー [eV]	フィッティング範囲 [eV]	Be の厚み [µm]	微小元素の厚み [nm]
Cr	5989	5500-6050	$247.93 {\pm} 0.04$	$1.1 {\pm} 0.2$
Mn	6539	6510-6900	$253.08 {\pm} 0.26$	< 0.3
Fe	7112	7000-7500	$251.41 {\pm} 0.22$	$14.5 {\pm} 0.2$
Ni	8333	8200-8450	$259.70{\pm}0.23$	$8.6{\pm}0.2$
Cu	8979	8800-9180	$275.63 {\pm} 0.07$	$0.8{\pm}0.1$

表1:フィッティングで得られた微小元素の厚み

高くなっていることがわかる。他の 3 つのエネルギ ーでもこの兆候が見られ、Beの圧延の際に左下部が 薄くなってしまったことが考えられる。

#### 4 <u>まとめ</u>

以上より、これまで未解明だった不連続な透過率 低下構造について、物理的に解釈し、モデル化する ことに成功した。本研究で作成したゲートバルブ透 過率モデルを用いて、XRISM衛星の初期観測データ から革新的な科学成果が得られることが期待される。 本研究の詳細については[6]にまとめた。

### 参考文献

- [1] Porter F. S. et al., 2018, Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems, 4, 1, 011218
- [2] Yoshida Y. et al., 2017, Proc. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 103971D
- [3] Hoshino A. et al., 2017, Proc. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 103970E
- [4] Tsujimoto M. et al., 2018, Publications of the Astronomical Society of Japan, 70, 20
- [5] Eckart M. E. et al., 2018, "XARM Resolve Calibration Requirements (RESOLVE-SYS-REQ-0017)"
- [6] Midooka, T. 2020, "Ground calibration of XRISM for the initial observations -- X-ray transmission of the gate valve of the cryostat for the low-temperature detector." Master thesis, The university of Tokyo

\* midooka@ac.jaxa.jp